

Научная программа стендовых докладов

5-ой Школы молодых ученых «Современные методы электронной и зондовой микроскопии в исследованиях органических, неорганических наноструктур и нанобиоматериалов»

Название секции. **1. Новые методы микроскопии, электронной дифракции и микроанализа**

ФИО докладчика	Название доклада
<i>Ерофеева В. О., Барабанова Е.В., Бойцова К.Н.</i>	<i>Влияние обработки поверхности на доменную структуру сегнетоэлектрических кристаллов SBN61</i>
<i>Лашкова А.К.</i>	<i>Методика панорамного анализа для изучения специфики доменной структуры в кристаллах TGS с профильным распределением примеси.</i>
<i>Лисниченко И. А., Григорян А.А., Филиппова А.В., Болдырев Ф.М., Березовский В.С.</i>	<i>Морфологические особенности технической натрий- карбоксиметилцеллюлозы марки 75 и ее влияние на вязкость формируемых растворов</i>
<i>Прасолов Н. Д., Ермаков И.А., Брунков П.Н., Гуткин А.А., Конников С.Г.</i>	<i>Субнанометровая литография атомно-гладкой поверхности полупроводника зондом АСМ</i>
<i>Селезнева Е.В., Макарова И.П., Васильев А.Л.</i>	<i>Взаимосвязь состава, структуры и свойств суперпротонных кристаллов с катионным замещением</i>
<i>Шутов А. С., Рогожкин С.В., Алеев А.А., Лукьянчук А.А., Разницын О.А.</i>	<i>Развитие методов анализа данных атомно-зондовой томографии для характеризации особенностей структурно-фазового состояния материалов</i>

Название секции. 2. Применение микроскопии в биологии и медицине, Крио-ЭМ

ФИО докладчика	Название доклада
<i>Sharov G., Voltz K., Durand A., Kolesnikova O., Papai G., Myasnikov A.G., Dejaegere A., Ben-Shem A., Schultz P.</i>	<i>Structure of the transcription activator target Tra1 within the chromatin modifying complex SAGA</i>
<i>Баймухаметов Т.Н., Чесноков Ю.М., Афонина Ж.А., Мясников А.Г., Васильев А.Л.</i>	<i>Исследование пространственной организации макромолекулярных комплексов методами крио-электронной томографии</i>
<i>Петренко Д.Е., Волков Д.А., Григорьев Т.Е., Васильев А.Л.</i>	<i>Определение микроструктуры композита наночастицы Ag-хитозан методами электронной микроскопии</i>

Название секции. 3. Микроскопия и сопряженные методы в материаловедении.

ФИО докладчика	Название доклада
<i>Базирувиха А.-М., Воротилов К.А., Серегин Д.С.</i>	<i>РЭМ для исследования пор в сегнетоэлектрических гетероструктурах на основе PZT</i>
<i>Заводов А. В., Лукина Е.А.</i>	<i>Анализ сложных электронограмм с применением математического моделирования и визуализацией на примере двухфазных металлических сплавов</i>
<i>Зубкова Е.И., Кирсанкин А.А.</i>	<i>СТМ-исследование наночастиц меди на поверхности графита</i>
<i>Колосов В.Ю., Веретенников Л.М., Юшков А.А., Бокуняева А.О.</i>	<i>Кристаллизация пленок Sb с градиентом толщины: многообразие кристаллографических ориентировок, текстуры, морфологии зёрен и островков, аморфной составляющей</i>
<i>Крылова М.В., Абдюханов И.М., Алексеев М.В., Цаплева А.С., Каратеев И.А., Овчаров А.В.,</i>	<i>Изучение микроструктуры Nb₃Sn сверхпроводников методами сканирующей и просвечивающей электронной</i>

<i>Трунькин И.Н., Фигуровский Д.К., Васильев А.Л.</i>	<i>микроскопии</i>
<i>Парсегова В.С., Зыбина Ю.С., Лазаренко П.И.</i>	<i>Исследование морфологии поверхности тонких плёнок Ge₂Sb₂Te₅ для фазовой памяти методом растровой электронной микроскопии</i>
<i>Пресняков М.Ю., Синецкая Д.А., Канюков Е.Ю., Демьянов С.Е., Белоногов Е.К.</i>	<i>Электронно-микроскопическое исследование фазового состава и структуры ионно- плазменного конденсата PdCu в порах аморфной матрицы SiO₂</i>
<i>Савин С.С., Беспалов А.В., Голикова О.Л., Гераськин А.А.</i>	<i>Применение РЭМ для исследования ультратонких пленок золота на стадии зарождения в условиях многократного ионно-лучевого осаждения/распыления</i>
<i>Седловец Д.М., Князев М.А., Трофимов О.В.</i>	<i>Зависимость свойств графеноподобных пленок от пара-метров предварительного экспонирования подложек элек- тронами</i>
<i>Снигирев Л. А.</i>	<i>Диагностика кристаллических структур с метаморфными буферами методом ПЭМ</i>
<i>Сушков А.А., Павлов Д.А., Байдусь Н.В., Рыков А.В., Новиков А.В., Юрасов Д.В.</i>	<i>Гексагональная фаза AlAs на Ge/Si (112): исследование поперечного среза</i>

Название секции. 4. Методы электронной микроскопии и микроанализа в исследовании предметов культурного наследия.

ФИО докладчика	Название доклада
<i>Кадикова И.Ф.</i>	<i>Комплексное исследование стеклянного бисера XIX века методами колебательной спектроскопии и электронной микроскопии.</i>
<i>Мандрыкина А. В., Терещенко Е.Ю., Васильев А.Л.</i>	<i>Структурный аспект электронно-микроскопических и рентгеновских исследований античной керамики п-ова Крым</i>